

2017年5月号

特集：逆問題手法による計測技術

逆問題 (Inverse problem)は、入力 (原因) から出力 (結果、観測) を求める問題を順問題 (Direct problem) とすると、その逆に出力から入力を推定する問題や、入出力の関係性を推定することとされている。順問題と逆問題は対の概念だが、どちらが順でどちらが逆化というのは相対的な問題であり、一般に古くから問題として認識され、研究が行われている方が順問題と呼ばれている。その逆方向のプロセスで解く方法は、自明ではないのだが、それを解くことで何らかの工学的、その他の利用ができるような問題のことを逆問題とされている。一方、半導体技術の進展の恩恵を受けた現在の状況では、逆問題の考えの下に多くのデータを学習データとして使用される新たな計測技術の研究開発が行われている。今回は「逆問題手法による計測技術」を特集する。

No.	タイトル	執筆者
1	特集のポイント	
2	楽しい逆問題	東京大学
3	応力場CTスキャナー	慶應義塾大学
4	超解像における逆問題とその解法	東京大学
5	彗星ダストテイル三次元モデル逆解析法について	厚木市子ども科学館
6	コンピュータを使って作成したモデルを使用した光計測	宇都宮大学
7	X線小角散乱法によるパターン形計測法	リガク
8	リソグラフィにおける逆問題の光計測	キヤノン

※特集予定は都合により変更になる場合があります。詳細は営業担当にお尋ねください。

発行日：2017年4月25日
 申込締切：2017年3月25日
 原稿締切：2017年3月31日